

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/664,296	HIRANO ET AL.
Examiner	Art Unit
Varsha A. Kapadia	2627

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
			_
		<del></del>	
	:		

INT	NTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
ļ., <u></u>				

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
East search - see search history Consulted J. Habermehl	5/15/2006	VK
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		